

2017 (第10回) TEM Users Meeting

平成 29 年 12 月 8 日 (金) 東京大学 武田先端知ビル

東京大学・微細構造解析プラットフォーム
東京大学・日本電子産学連携室

Program

9:30 ~ 10:00	◆◇◆	受 付	◆◇◆
10:00 ~ 10:10		開会挨拶	
10:10 ~ 10:30		JEM-1400Flash の紹介	
		日本電子株式会社 EM 事業ユニット	濱元 千絵子
10:30 ~ 10:50		最新の自動収差補正システムを搭載した電子顕微鏡 NEOARM の紹介	
		日本電子株式会社 EM 事業ユニット	橋口 裕樹
10:50 ~ 11:10		その場観察電子顕微鏡の新しい展望	
		日本電子株式会社 EM 事業ユニット	福永 啓一
11:10 ~ 11:30		最新 FIB-SEM マルチビームシステム JIB-4700F の紹介	
		日本電子株式会社 IB 事業ユニット	門井 美純
11:30 ~ 13:10	◆◇◆	昼食・装置 / ポスター展示セッション	◆◇◆
13:10 ~ 14:00		原子分解能 STEM の進展と材料科学への応用	
		東京大学大学院 工学系研究科	幾原 雄一 様
14:00 ~ 14:10	◆◇◆	休 憩	◆◇◆
14:10 ~ 14:40		分析電子顕微鏡とプリセッション電子回折を用いた材料解析	
		株式会社東レリサーチセンター	久留島 康輔 様
14:40 ~ 15:00		高速ピクセル型 STEM 検出器の開発とその応用	
		日本電子株式会社 EM 事業ユニット	佐川 隆亮
15:00 ~ 15:30	◆◇◆	休憩・装置 / ポスター展示セッション	◆◇◆
15:30 ~ 16:10		強度輸送方程式による電子波位相の定量計測とその応用	
		国立研究開発法人 物質・材料研究機構	三留 正則 様
16:10 ~ 16:50		ソフトマテリアル電子顕微鏡観察におけるコントラスト増強と 3次元その場観察へ向けての取り組み	
		東北大学 多元物質科学研究所	陣内 浩司 様
16:50 ~ 17:00		閉会挨拶	
17:00 ~ 18:00	◆◇◆	懇 親 会	◆◇◆